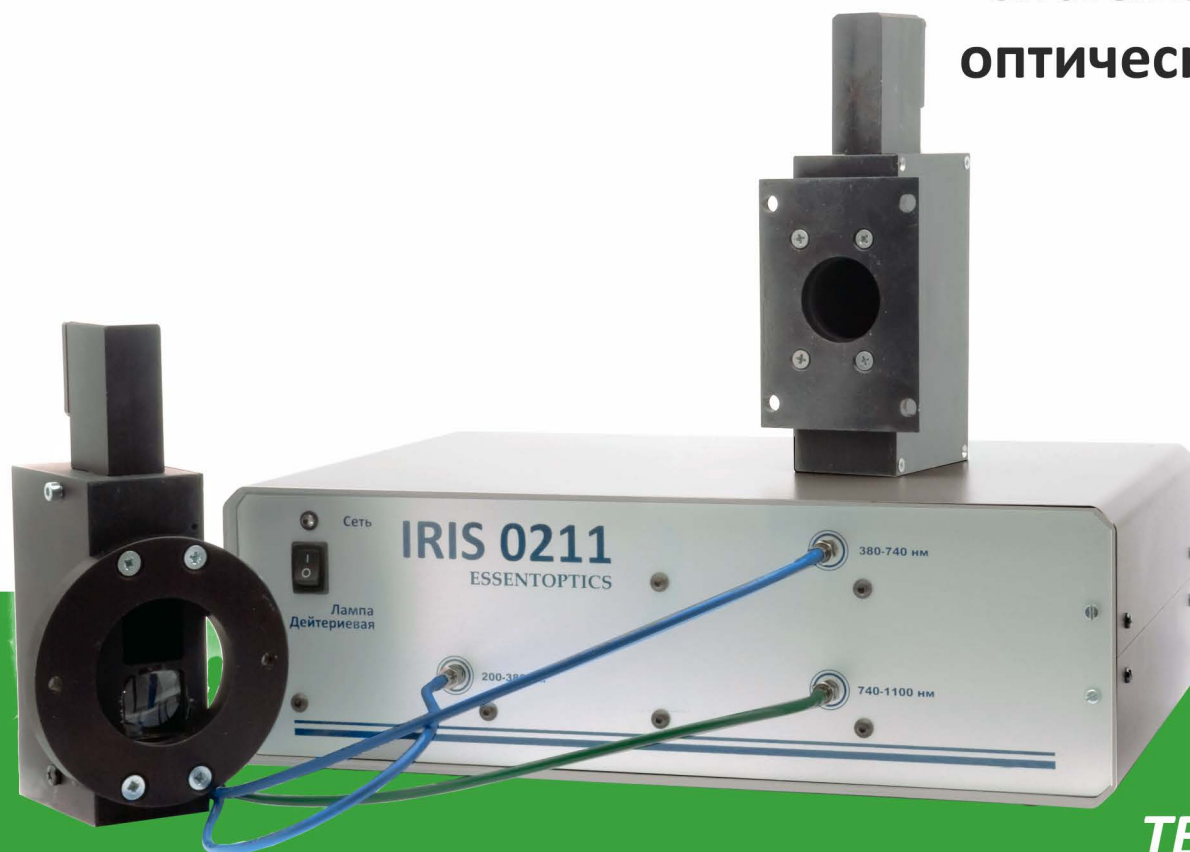


# IRIS

Системы широкополосного контроля  
оптических характеристик измерения



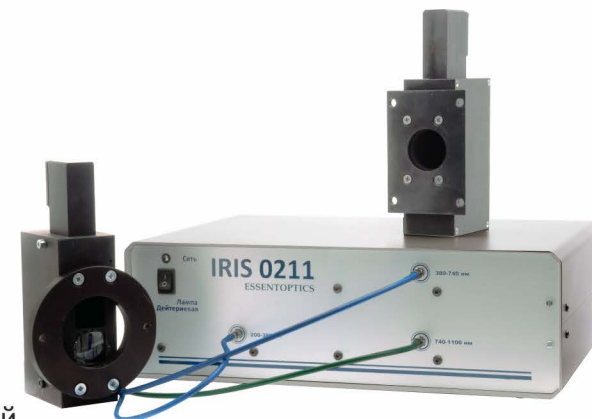
*ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Приборы серий IRIS являются надежным и удобным инструментом при решении задач по получению высококачественных оптических покрытий. Применение систем обеспечивает изготовление покрытий самых сложных спектральных характеристик, существенное снижение брака в покрытиях и более высокий коэффициент выхода годных процессов.

### Ключевые достоинства и преимущества:

- Существенное снижение материальных затрат и времени на отработку новых процессов и покрытий
- Быстрый ввод систем в эксплуатацию – все работы по монтажу, запуску, настройке и обучению занимают не более 1-2 дней
- Наблюдение за ростом покрытия в реальном масштабе времени
- Повышенная точность и стабильность измерений за счет применения модуляции источника излучения.
- Коррекция покрытия в процессе напыления благодаря послойным наблюдениям
- Высокая воспроизводимость оптических характеристик
- Удобный интерфейс, позволяющий получать оператору/технологу точную и необходимую информацию.



## Технические характеристики систем измерения серии IRIS (на базе спектрометра EOS 45 собственной разработки)

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА	IRIS 0204	IRIS 0207	IRIS 0211	IRIS 0407	IRIS 0411	IRIS 1017	IRIS 1017ex	IRIS 0417	IRIS 0417 ex
Спектральный диапазон, нм	190 - 380	190 - 740	190 - 1100	380 - 740	380 - 1100	950 - 1700	950-2450	380 - 1700	380 - 2500
Спектральное разрешение, нм	0,8	0,8 (190 - 380 нм) 1,6 (380 - 740 нм)	0,8 (190 - 380 нм) 1,6 (380 - 1100 нм)	1,6		3,2	10	1,8 (380 - 1050 нм) 3,6 (950 - 1700 нм)	1,8 (380 - 1050 нм) 13,0 (950 - 2500 нм)
Воспроизводимость длины волны, нм	0,2	0,4				0,8	3,2	0,4 (380 - 1050 нм) 0,8 (950 - 1700 нм)	0,4 (380 - 1050 нм) 3,5 (950 - 2500 нм)
Точность установки длины волны, нм	0,4	0,8				1,6	6,8	0,8 (380 - 1050 нм) 1,6 (950 - 1700 нм)	0,8 (380 - 1050 нм) 6,5 (950 - 2500 нм)
Фотометрические функции	T% / R% *								
Спектрометр	EOS UV	EOS UV-VIS	EOS UV-IR	EOS VIS	EOS VIS-IR	EOS IR	EOS IR	EOS VIS / IR	EOS VIS / IR
Диапазон измерения: T%	0,01 – 120%								
Источник света	Дейтериевая лампа	Дейтериевая лампа / Галогенная лампа		Галогенная лампа					
Точность измерения	<0,01 x T **								
Воспроизводимость измерения	0,005 x T **								
Стабильность базовой линии	0,01 x T/час								
Уровень рассеянного света	0,01 x T <sub>макс</sub>								
Коммуникационный порт	USB 2.0								
Время измерения полного диапазона, мс	от 10 мс, рекомендуемое время измерение полного диапазона 20-80 мс***								
Потребляемая мощность, Вт	50			30				50	
Питание	100-240 В, 50/60 Гц								
Вес нетто, кг	10	12	14	10	12	12	16	15	16

\* Измерение пропускания и отражения возможно с перестановкой осветителя или с заказом двух блоков осветителей в комплекте поставки.

\*\* После 30 мин прогрева дейтериевой лампы и 10 мин прогрева галогенной лампы.

\*\*\* Зависит от итоговой конфигурации системы контроля и фактической конструкции вакуумной установки.

Различные варианты конфигурации систем контроля всегда возможны по согласованию с Заказчиком.

ООО ЭссентОптикс  
223053 Республика Беларусь  
Минская обл., Минский р-н, Боровляны  
ул. 40 лет Победы 23А-81  
Тел.: +375 17 5112025, Факс: +375 17 511 2026  
E-mail: office@essentoptics.com  
www.essentoptics.com